

Modell alapú tesztelés

Majzik István és Micskei Zoltán
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
<http://www.inf.mit.bme.hu/>

Tartalomjegyzék

- **Motiváció**
 - Modellek (informális) szerepe a tesztelésben
 - Modell alapú tesztgenerálás
- **Tesztgenerálás fedettségi kritériumokhoz**
 - Direkt algoritmusok
 - Modellellenőrzők használata
 - Tesztgenerálás korlátos modellellenőrzéssel
- **Tesztgenerálás hibamodellek alapján**
 - Modell mutációk
 - Ekvivalencia relációk tesztgeneráláshoz
- **Eszközök a tesztgeneráláshoz**

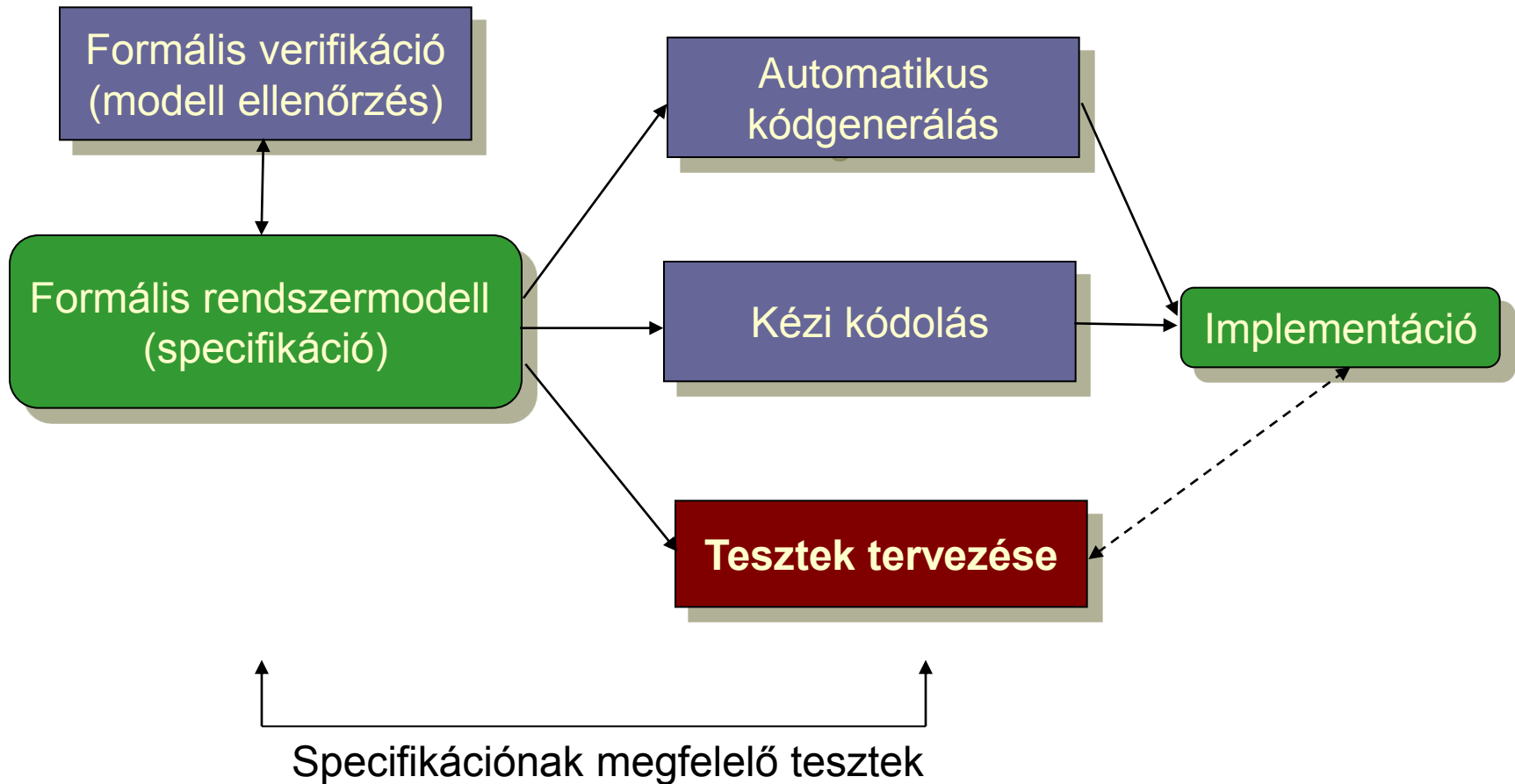
UML modellek tipikus használata a tesztelésben

- Használati eset diagram:
 - Validációs tesztelés: tesztelendő használati esetek
- Osztály- és objektumdiagram:
 - Modultesztelés: komponensek, interfészek azonosítása
- Állapottérkép és aktivitás diagram:
 - Modultesztelés: strukturális teszteléshez referencia
- Üzenet-szekvencia és együttműködési diagram:
 - Integrációs tesztelés: forgatókönyvek leírása
- Komponens diagram:
 - Rendszertesztelés: tesztelendő fizikai komponensek
- Telepítés diagram:
 - Rendszertesztelés: teszt konfiguráció

Tartalomjegyzék

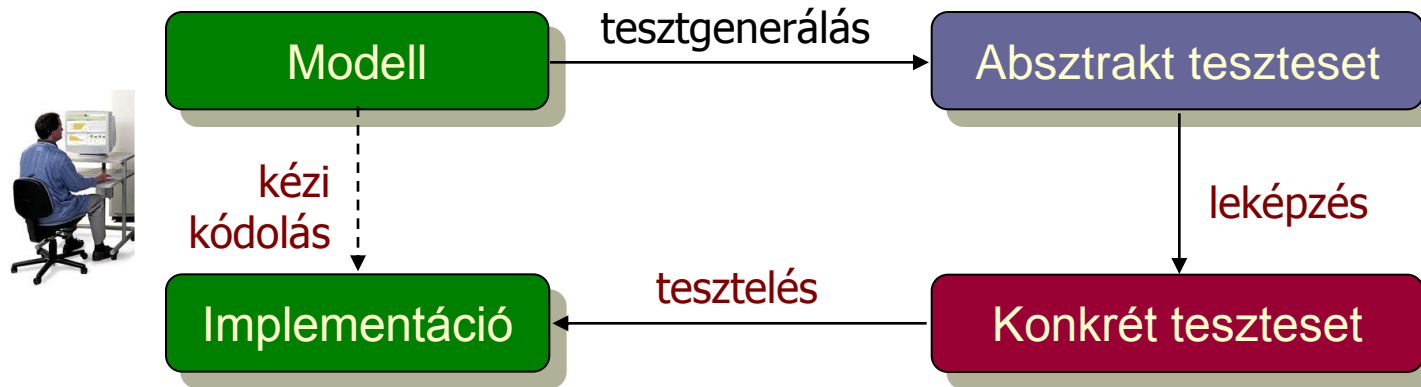
- **Motiváció**
 - Modellek szerepe a tesztelésben
 - **Modell alapú tesztgenerálás**
- **Tesztgenerálás fedettségi kritériumokhoz**
 - Direkt algoritmusok
 - Modellellenőrzők használata
 - Tesztgenerálás korlátos modellellenőrzéssel
- **Tesztgenerálás hibamodellek alapján**
 - Modell mutációk
 - Ekvivalencia relációk tesztgeneráláshoz
- **Eszközök a tesztgeneráláshoz**

Modell alapú fejlesztési folyamat (részlet)

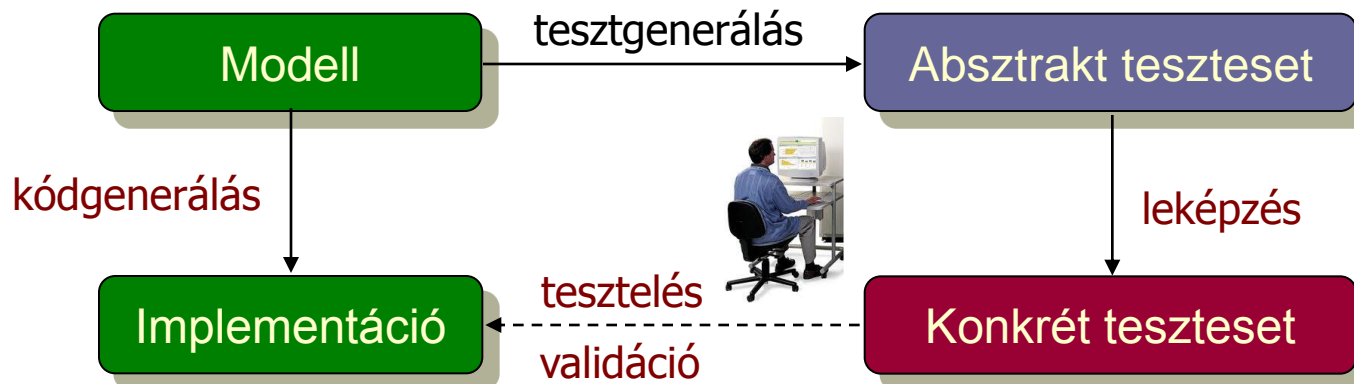


Használati esetek

- Kézi kódolás esetén: Konformancia ellenőrzés

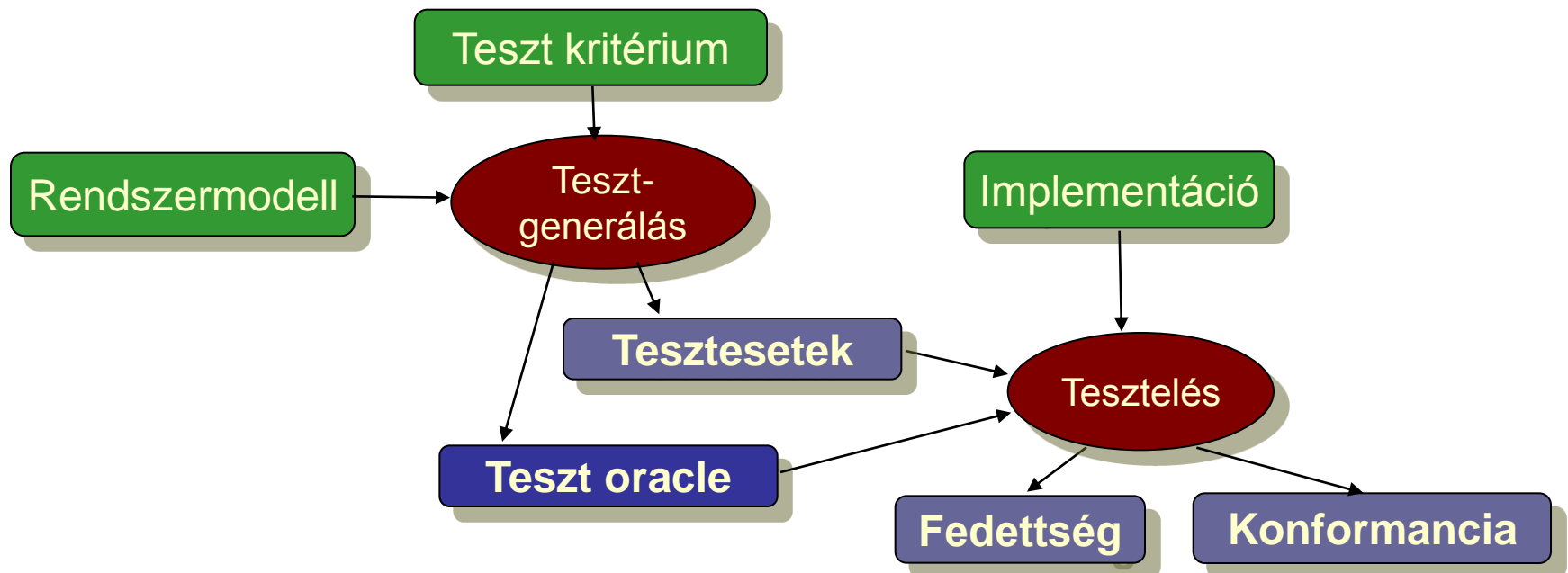


- Automatikus kódgenerálás esetén: Validáció



Modell alapú tesztelés alapfeladatai

- Rendszermodell és tesztelési kritérium alapján:
 - Tesztek generálása (pl. modell fedettséghez)
 - Teszt kiértékelő (test oracle) generálása
 - Teszt fedettség elérése (modell alapon)
 - Konformancia megállapítása (modell és implementáció között)



Tartalomjegyzék

- Motiváció
 - Modellek szerepe a tesztelésben
 - Modell alapú tesztgenerálás
- **Tesztgenerálás fedettségi kritériumokhoz**
 - **Direkt algoritmusok**
 - Modellellenőrzők használata
 - Tesztgenerálás korlátos modellellenőrzéssel
- Tesztgenerálás hibamodellek alapján
 - Modell mutációk
 - Ekvivalencia relációk tesztgeneráláshoz
- Eszközök a tesztgeneráláshoz

A direkt algoritmusok tipikus alkalmazási területe

- **Állapot alapú, eseményvezérelt működés**
 - Eseményre triggerelt állapotátmenetek
 - Akciók (mint válasz jellegű kimenetek)
- **Használható modellek**
 - Automaták (FSM; Mealy, Moore, Büchi, ...)
 - Magasabb szintű formalizmusok leképezhetők
 - UML állapottérkép
 - SCADE Safe Statechart
 - Simulink Stateflow
- **Gráfelméleti algoritmusok**
 - Algoritmus létezik sokféle tesztelési feladathoz
 - Optimális tesztek: Tipikusan NP-teljes algoritmusok ☹️

Gráfelméleti algoritmus átmenet fedéshez

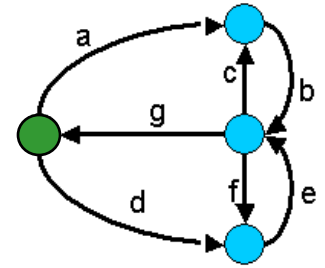
- Problémák megfeleltetése

- Tesztelési probléma: **Átmenetek fedése**

- Minden átmenet fedése teszt szekvenciával
 - A teszt szekvencia vigyen vissza a kezdeti állapotba

- Gráfelméleti probléma: **„New York-i utcaseprő” probléma**

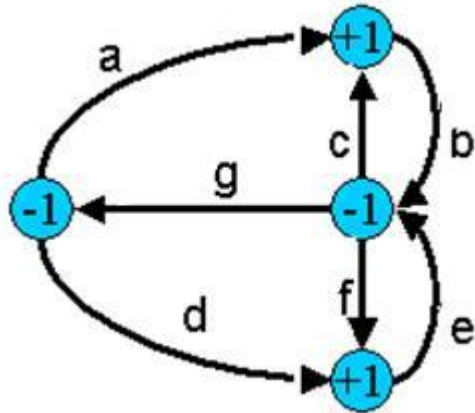
- Egy irányított gráfban mi az a (legrövidebb) bejárási szekvencia, ami **minden élet bejár** és a kezdeti helyre visz vissza?
 - (Ugyanez nem irányított gráfban: „Kínai postás” probléma)



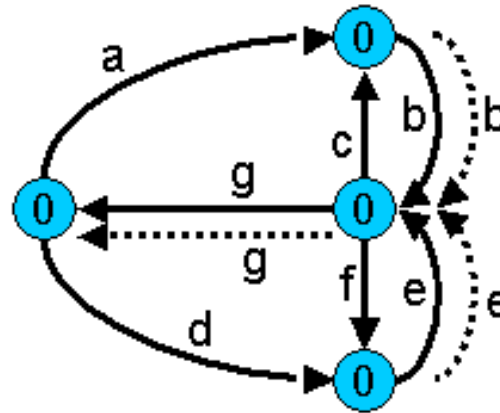
- Megoldás alapötlete:

- Helyek polaritásainak számítása: Bejövő mínusz kimenő élek száma
 - Olyan élek duplikálása, amelyek pozitívtól negatív polaritású helyekig vezetnek, amíg minden hely nulla polaritású nem lesz
 - **Euler-kör** keresése az így adódó gráfban (lineáris algoritmus)
 - Euler-kör: Minden élet bejár; ilyen gráfban biztosan képezhető
 - Az Euler-kör bejárása adja a teszt szekvenciát

Egy példa átmenet fedéshez



Eredeti gráf
hely polaritásokkal



Duplikált élekkel
kiegészített gráf (Euler-gráf)

Bejárási szekvencia (Euler-kör):

a b c b f e g d e g

Gráfelméleti algoritmus átmenet kombináció fedéshez

- Problémák megfeleltetése

- Tesztelési probléma: **Átmenet kombinációk fedése**

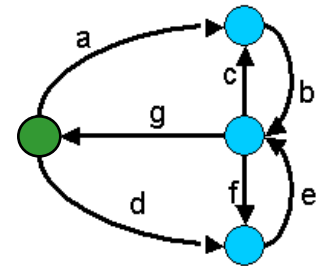
- Minden lehetséges, egymás után n számú átmenetből álló sorozat fedése a teszt szekvenciával
 - A teszt szekvencia vigyen vissza a kezdeti állapotba
 - Legegyszerűbb eset: Minden lehetséges **átmenet-pár** fedése

- Gráfelméleti probléma: **„Bankrabló” probléma**

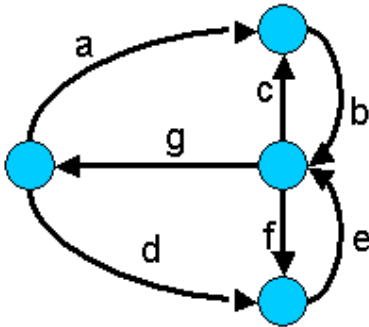
- (Legrövidebb) élszekvencia, amiben minden lehetséges n hosszú élsorozat előfordul (legegyszerűbb eset: $n=2$)

- Megoldás (de Bruijn algoritmus) alapötlete ($n=2$):

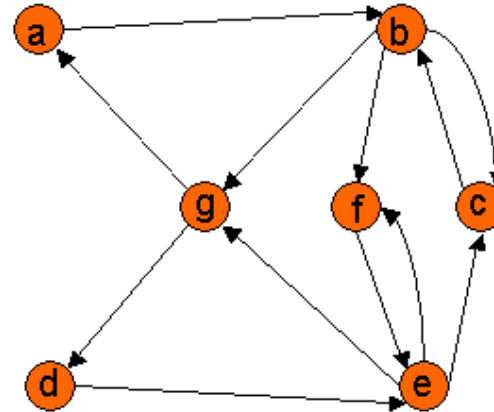
- **Duális gráf** megkezdése: Az eredeti gráf éleiből helyek lesznek
 - Az eredeti gráfban létező élpárok esetén él behúzása a duális gráfba az élek által adott helyek közé
 - A duális gráf kiegészítése (élek duplikálásával) Euler-gráffá
 - Az így kapott gráfban az Euler-kör adja a teszt szekvenciát



Egy példa átmenet kombináció fedéshez



Eredeti gráf



Duális gráf az élpárokkal

Bejárási szekvencia a duális gráf alapján élpárok fedéséhez:

a b c b f e c b g d e f e g

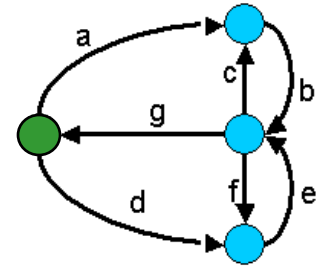
Gráfelméleti algoritmus konkurens átmenet fedéshez

- Problémák megfeleltetése

- Tesztelési probléma:

Konkurens tesztelés átmenetek fedéséhez

- Teljes átmenet fedés a cél, de több tesztelő van
 - Célszerű egyenletesen megosztani a problémát, hogy a legrövidebb idő alatt végezzenek; mindegyik a kezdőállapotból kezd
 - Feltétel: Egy bemenettel bárhonnán kezdőállapotba vihető a rendszer

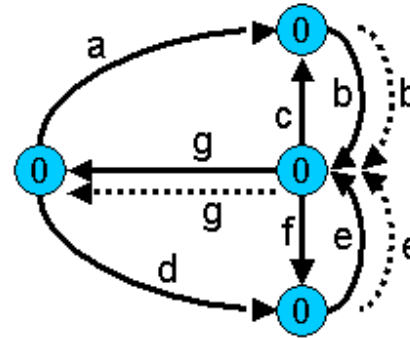
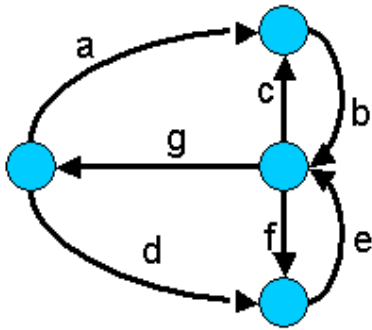


- Gráfelméleti probléma: „Utcapró brigád” probléma

- Megoldás: Heurisztika (nem optimális megoldás)

- Egy-egy bejáráshoz k felső határ megadása
 - Olyan élszekvencia keresése, amely a legtöbb eddig nem érintett élet tartalmazza, de legfeljebb k hosszú; a végén kezdőállapotba vezérelve a bejárást
 - Ezután újabb élszekvenciák felvétele, amíg van be nem járt él
 - A k felső határral lehet próbálkozni

Egy példa konkurens átmenet fedéshez



Eredeti bejárási szekvencia (Euler-kör, 1 tesztelő):

a b c b f e g d e g

Egy lehetséges megosztás 2 tesztelőre:

- Tesztelő 1: a b c b f e g (7 időegység kell)
- Tesztelő 2: d e g

Egy jobb megosztás (heurisztikával) 2 tesztelőre:

- Tesztelő 1: a b c b g (5 időegység kell)
- Tesztelő 2: d e f e g

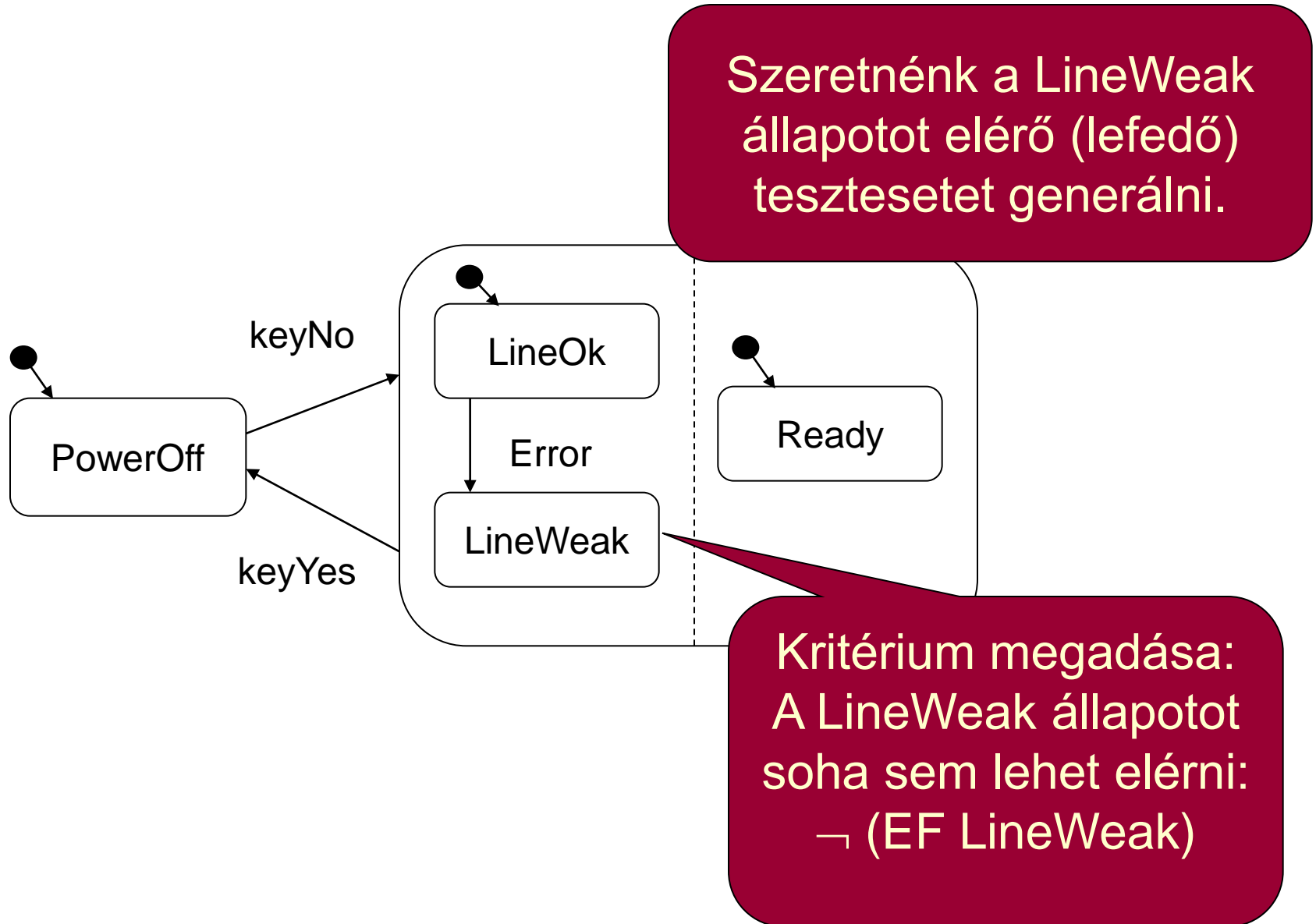
Tartalomjegyzék

- Motiváció
 - Modellek szerepe a tesztelésben
 - Modell alapú tesztgenerálás
- **Tesztgenerálás fedettségi kritériumokhoz**
 - Direkt algoritmusok
 - **Modellellenőrzők használata**
 - Tesztgenerálás korlátos modellellenőrzéssel
- Tesztgenerálás hibamodellek alapján
 - Modell mutációk
 - Ekvivalencia relációk tesztgeneráláshoz
- Eszközök a tesztgeneráláshoz

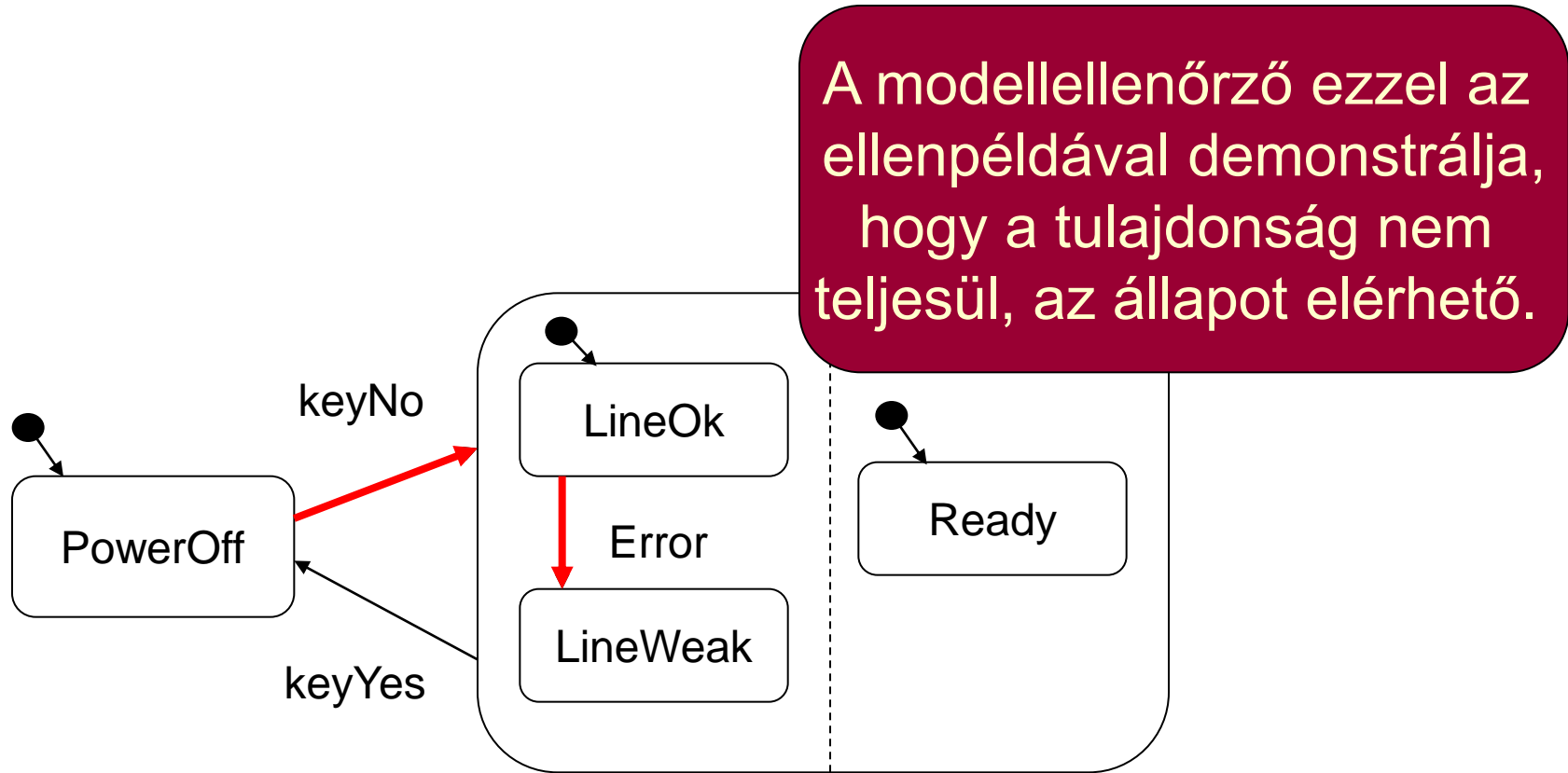
Alapötlet

- Tipikus tesztelési kritériumok:
 - Vezérlés alapú: **Állapotok, átmenetek** lefedése, **be- és kimenő átmenet-párok** lefedése egy-egy állapothoz
 - Adatfolyam alapú: **Változó definiálások és felhasználások** lefedése
- Tesztgeneráláshoz szükséges:
 - Állapottér bejárása → Modellellenőrző is ezt csinálja
- Alapötlet:
 - Járja be a modellellenőrző az állapotteret!
 - Irányítsuk úgy, hogy az általa adott **ellenpélda** legyen a teszteset!

A modellellenőrző használata tesztergenerálásra



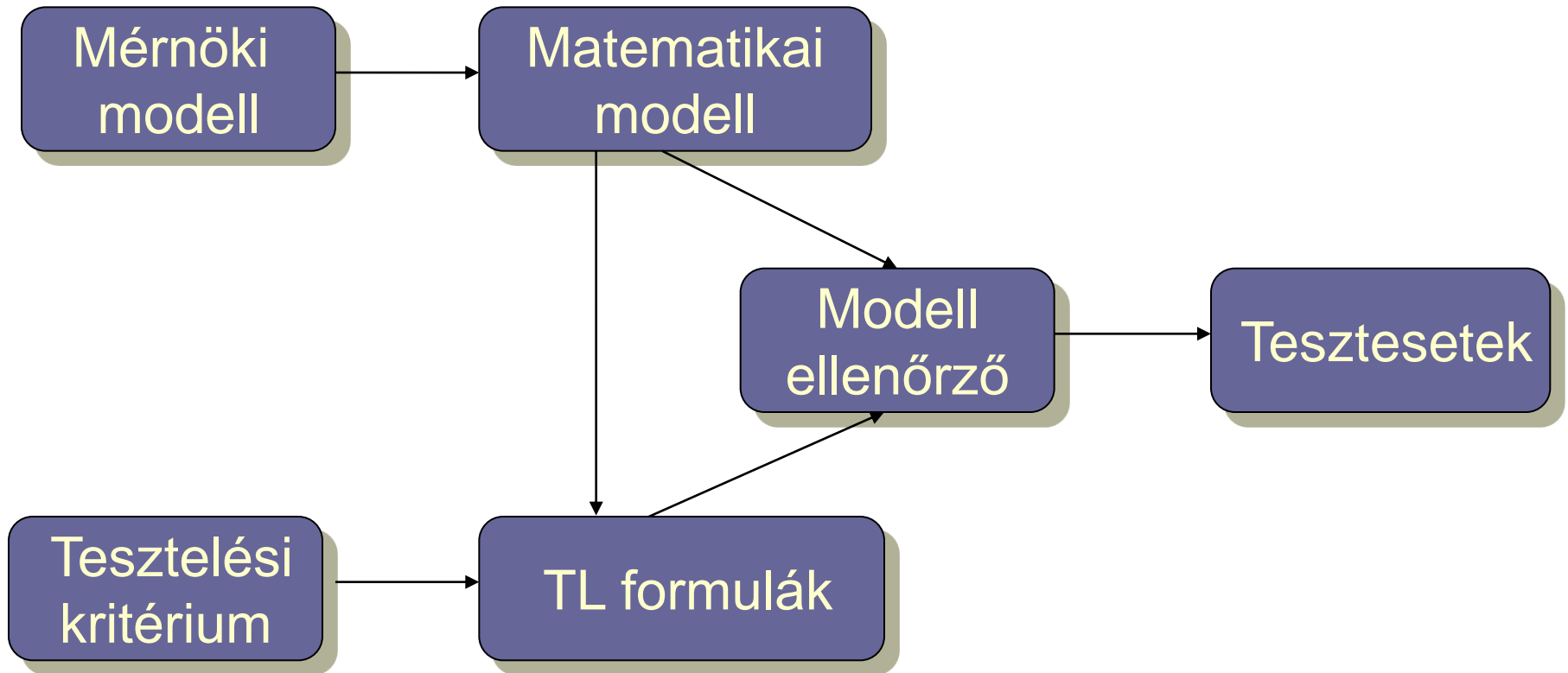
A modellellenőrző használata tesztkgenerálásra



A modellellenőrző ezzel az ellenpéldával demonstrálja, hogy a tulajdonság nem teljesül, az állapot elérhető.

Ez viszont pontosan egy, a LineWeak állapotot lefedő teszteset!

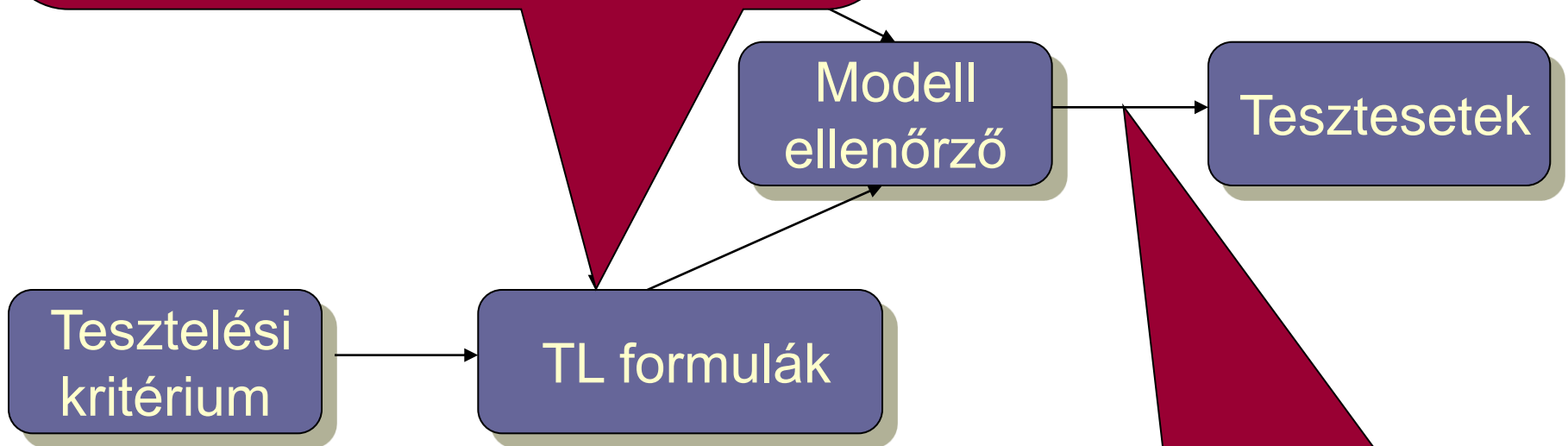
Automatikus tesztgenerálás



Automatikus tesztingenerálás

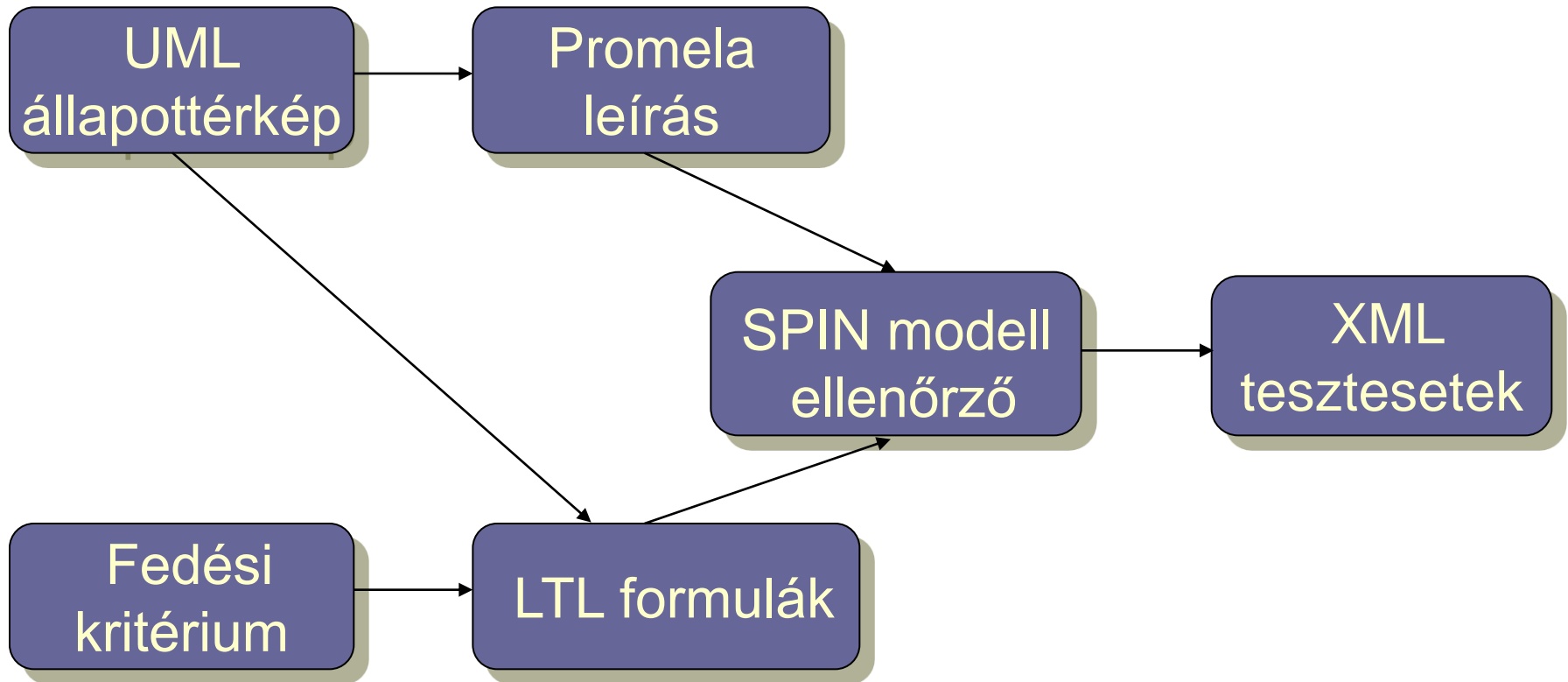
A fedési kritériumokat temporális logikai formulákkal fogalmazzuk meg.

Például: Legyen minden egyes állapot lefedve tesztek által.



A kiadódó ellenpéldák egy-egy tesztesetet adnak meg.

Egy megvalósítás



Fedettségi kritériumok mint TL kifejezések

- Címkék a modellben v változóra (predikátumok):

- $\text{def}(v)$
- $\text{c-use}(v)$
- $\text{p-use}(v)$
- $\text{implicit-use}(v)$

A változó használata implicit átmenet feltételében.
Implicit átmenet: Helyben maradást jelent (az adott feltétel mellett); ez is tesztelhető.

- Karakterisztikus függvények (állapotváltozókkal):

- s : adott s állapotban való tartózkodás
- t : adott t átmenet tüzelése (állapot és következő állapot)

- Állapothalmazok (\rightarrow predikátumok diszjunkcióval):

- $d(v)$: minden $\text{def}(v)$
- $u(v)$: minden $\text{c-use}(v)$ vagy $\text{p-use}(v)$
- $\text{im-u}(v)$: minden $\text{implicit-use}(v)$
- exit : megfelelő állapotok új teszthez (pl. kezdőállapotok)

Vezérlés alapú fedettségi kritériumok

- **Állapotfedés:**

$$\{\neg EF s \mid s \text{ alapszintű állapot}\}$$

Kritériumhalmaz!

Ha megfelelő stabil állapot is kell újabb teszthez:

$$\{\neg EF (s \wedge EF \text{ exit}) \mid s \text{ alapszintű állapot}\}$$

A további képletekben itt EF exit nem szerepel.

- **Gyenge átmenet fedés:**

$$\{\neg EF t \mid t \text{ átmenet}\}$$

- **Erős átmenet fedés:**

$$\{\neg EF t \mid t \text{ átmenet}\} \cup \{\neg EF it \mid it \text{ implicit átmenet}\}$$

Erős fedés: Implicit átmenetek (helyben maradás) is tesztelve

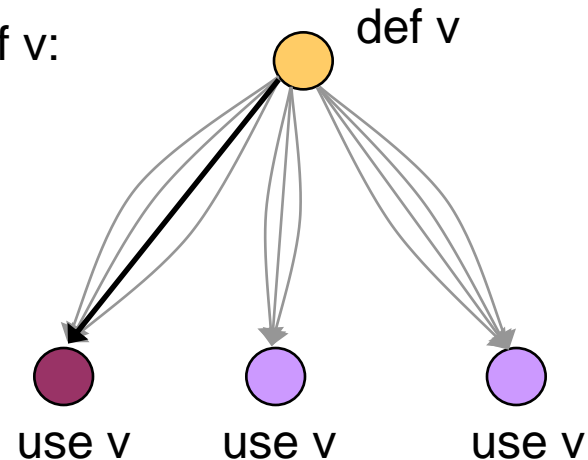
Adatfolyam alapú fedettségi kritériumok (ismétlés)

- All-defs:

minden v , minden def v :

egy def-clear
útvonal:

egy use v :

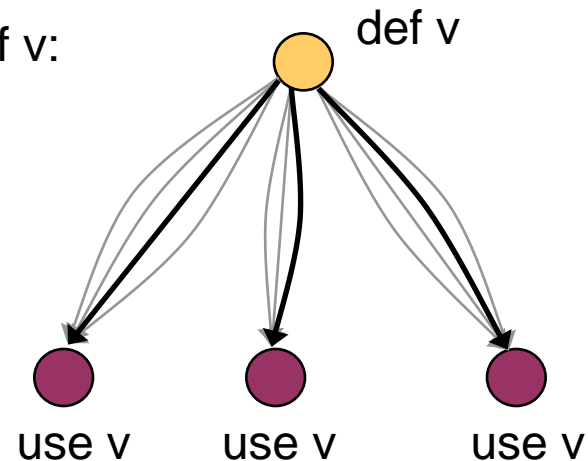


- All-uses:

minden v , minden def v :

egy def-clear
útvonal:

minden use v :



Adatfolyam alapú fedettségi kritériumok

- Gyenge all-defs fedés:

$$\{\neg EF (t \wedge EX E(\neg d(v) \cup u(v))) \mid v \text{ változó, } t \in d(v)\}$$

Egy def-clear útvonal tesztelve minden def(v) és egy use(v) között

- Gyenge all-uses fedés:

$$\{\neg EF (t \wedge EX E(\neg d(v) \cup t')) \mid v \text{ változó, } t \in d(v), t' \in u(v)\}$$

Egy def-clear útvonal tesztelve minden def(v) és minden use(v) között

- Erős all-defs fedés:

$$\{\neg EF (t \wedge EX E(\neg d(v) \cup (u(v) \vee im-u(v)))) \mid v \text{ változó, } t \in d(v)\}$$

Implicit változó használat (~ helyben maradás feltétele) is tesztelve

- Erős all-uses fedés:

$$\{\neg EF (t \wedge EX E(\neg d(v) \cup t')) \mid v \text{ változó, } t \in d(v), t' \in u(v) \cup im-u(v)\}$$

Jellegzetességek

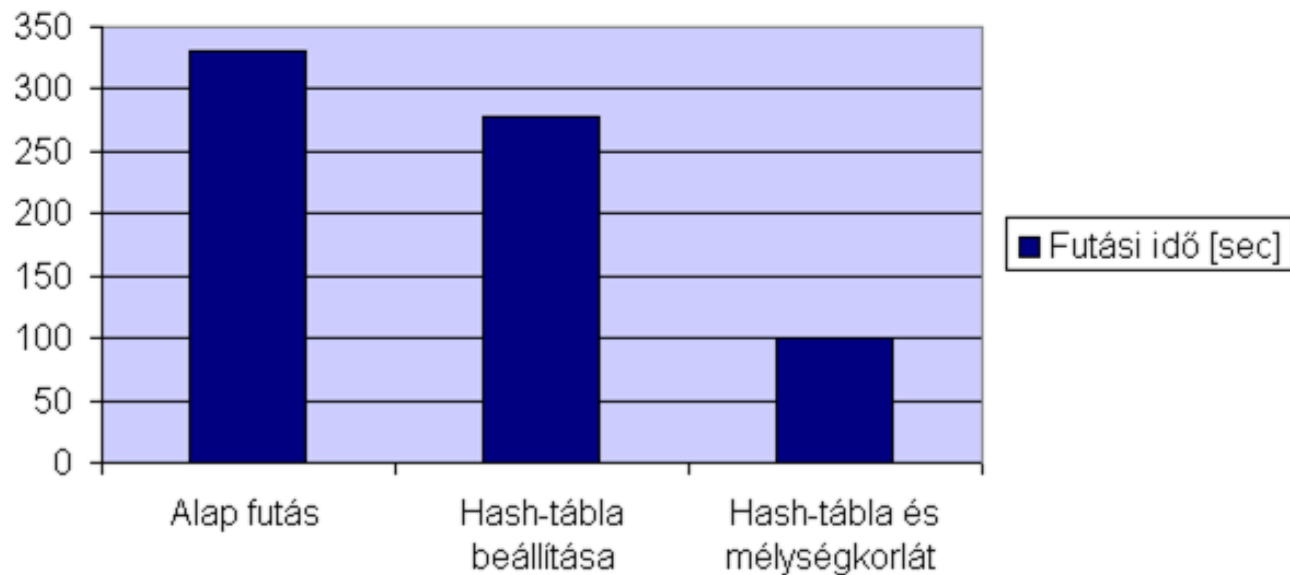
- Modellellenőrző képességei:
 - Csak egy ellenpéldát generál
 - Így nem generálhatók tesztek olyan fedettségi kritériumokhoz, ahol minden ellenpéldára szükség van
 - pl. **all-du-paths** kritérium
(minden def-clear útvonal egy def-use párhoz)
- Absztrakt teszt eset adódik
 - Sokszor csak a bemeneti szekvencia kötött
 - Elvárt kimeneteket meg kell határozni (szimulációval)
- Nemdeterminisztikus modellek esete:
 - Egy bemeneti szekvenciához több bejárás (cél állapot)
 - Teszt végrehajtásakor figyelembe kell venni

Optimalizáció

- Modellellenőrző feladata:
 - Állapottér hatékony bejárása: Gyorsan, kis tárigénnyel
 - Ellenpélda generálása: Minél hamarabb álljon elő
- A tesztgenerálási feladat:
Gyorsan minél rövidebb ellenpéldát találni
 - Speciális beállítások szükségesek a modellellenőrzőben
 - Legrövidebb/legkisebb tesztkészlet kiválasztása: NP-teljes probléma!
- Lehetőségek (pl. SPIN modellellenőrző esetén):
 - Szélességi keresés az állapottérben (BFS)
 - Mélységi keresés, de mélységkorláttal (limited DFS)
 - Rövidebb ellenpélda iteratív keresése
 - Közelítő modell ellenőrzés (hash függvény az állapottároláshoz)
 - Bizonyos állapotokat nem jár be a keresés során
 - Ha talál ellenpéldát, az valós teszt lesz

„Mobiltelefon” példa: Teljes állapotfedésű tesztek

- Példa: Mobiltelefon vezérlését leíró állapottérkép
- 10 állapot, 21 átmenet



Tesztgenerálási eredmények

Options (compile or run-time)	Time required for test generation	Length of the test sequences	Longest test sequence
-i	22m 32.46s	17	3
-dBFS	11m 48.83s	17	3
-i -m1000	4m 47.23s	17	3
-I	2m 48.78s	25	6
default	2m 04.86s	385	94
-I -m1000	1m 46.64s	22	4
-m1000	1m 25.48s	97	16
-m200 -w24	46.7s	17	3

Paraméterek:

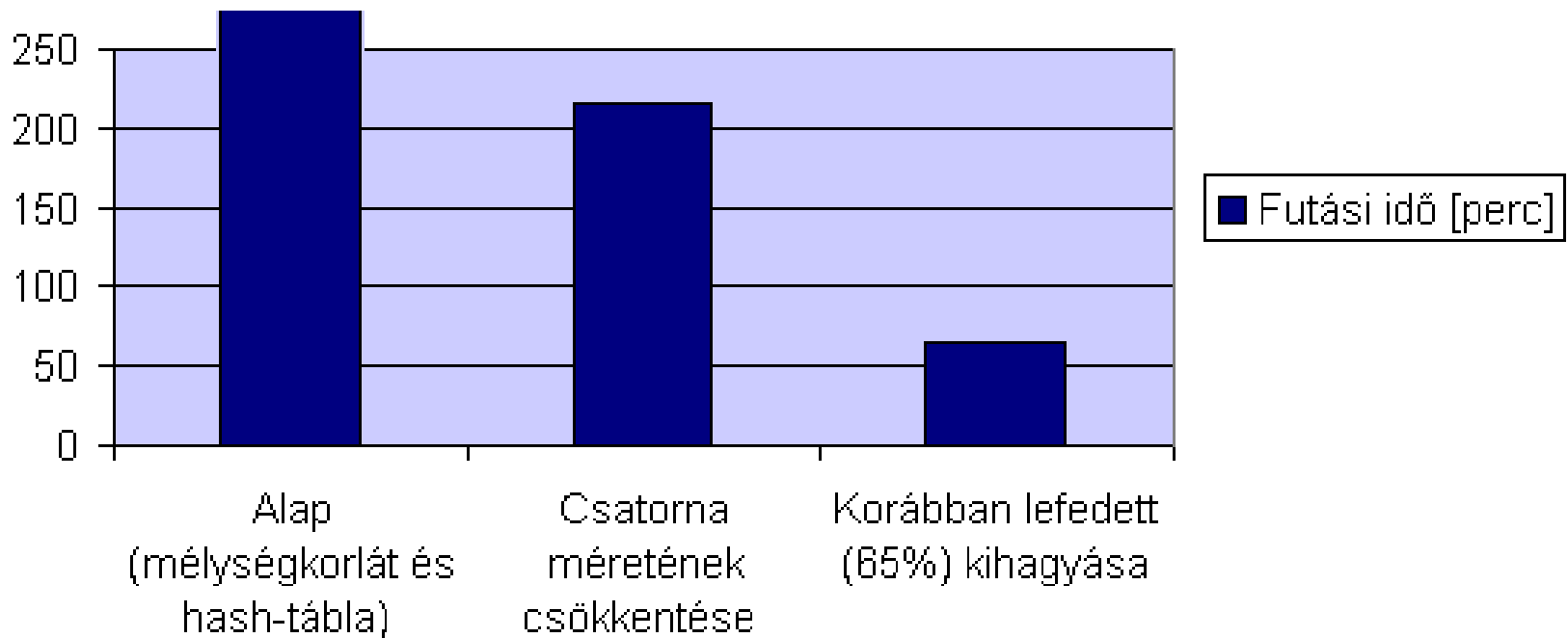
- i iteratív, -I közelítő iteratív
- dBFS szélességi keresés
- m mélységi keresés korlátja
- w hash tábla korlátja

Itt példamodell: Mobiltelefon
vezérlését leíró állapotgép
(10 állapot, 21 átmenet)

„Bitszinkronizációs protokoll” példa

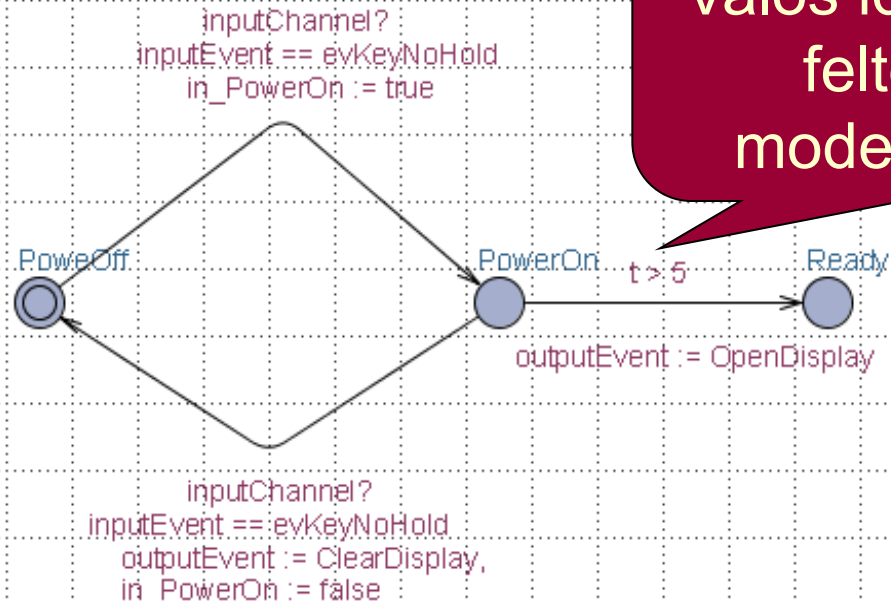
- Példa: Bitek szinkronizálása egy elosztott rendszerben
 - 5 objektum, 31 állapot, 174 átmenet
 - $2e+08$ bejárando állapot
- Más technikák is kellenek:
 - Erősen tömörítő állapotárolás alkalmazása (bitstate hashing)
 - Szűkítések a modellben: csatorna méret csökkentés
 - Korábban lefedett kritériumok kihagyása
- További heurisztikák alkalmazása:
 - Mélyen fekvő állapotok tesztelése előbb

„Bitszinkronizációs protokoll”: Tesztek generálása teljes állapotfedéshez



Kiterjesztés valós idejű rendszerekre

Óra változók:
Valós időt, időzítési
feltételeket
modellezhetünk



Időzített automaták használata
Speciális modellellenőrző: UPPAAL

Generált tesztek

State:

(input.sending mobile.PowerOn mobile1.LineOK mobile2.CallWait)

t=0 inputEvent=28 outputEvent=14

Delay: 6

State:

(input.sending mobile.PowerOn r

t=6 inputEvent=28 outputEvent=

Transitions:

input.sending->input.sendInput { 1, inputChannel!, 1 }

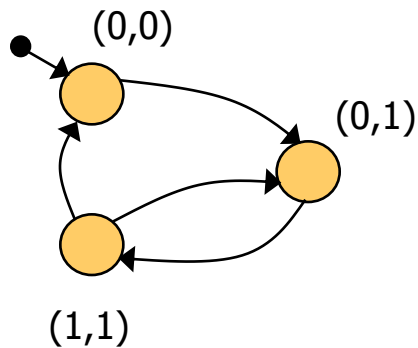
mobile2.CallWait->mobile2.VoiceMail { inputEvent == evKeyYes && t > 5 &&
in_PowerOn, inputChannel?, 1 }

A teszt időzítési viszonyok is szerepelnek a generált tesztesetben

Tartalomjegyzék

- Motiváció
 - Modellek szerepe a tesztelésben
 - Modell alapú tesztgenerálás
- **Tesztgenerálás fedettségi kritériumokhoz**
 - Direkt algoritmusok
 - Modellellenőrzők használata
 - **Tesztgenerálás korlátos modellellenőrzéssel**
- Tesztgenerálás hibamodellek alapján
 - Modell mutációk
 - Ekvivalencia relációk tesztgeneráláshoz
- Eszközök a tesztgeneráláshoz

Példa: A modell leképzése logikai függvénybe

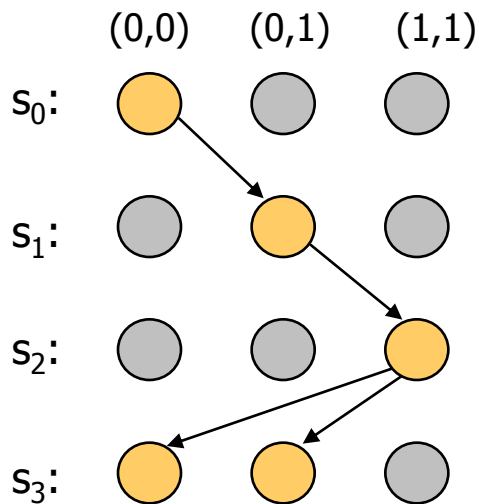


Kezdőállapot predikátum:

$$I(x,y) = (\neg x \wedge \neg y)$$

Állapotátmeneti reláció:

$$R(x,y,x',y') = (\neg x \wedge \neg y \wedge \neg x' \wedge y') \vee \\ \vee (\neg x \wedge y \wedge x' \wedge y') \vee \\ \vee (x \wedge y \wedge \neg x' \wedge y') \vee \\ \vee (x \wedge y \wedge \neg x' \wedge \neg y')$$



3 lépéses kihajtogatás a kezdőállapotból:

$$I(x_0, y_0) \wedge \\ R(x_0, y_0, x_1, y_1) \wedge \\ R(x_1, y_1, x_2, y_2) \wedge \\ R(x_2, y_2, x_3, y_3)$$

SAT alapú tesztgenerálás fedési kritériumokhoz

- Formula konstruálás tesztgeneráláshoz:
 - Kibontás k lépésben a kezdőállapotból
 - Teszt kritérium megadása: **TG** formula, pl.:
 - Adott s állapot elérése,
 - Adott t állapotátmenet végrehajtása,
 - Adott modellrészlet bejárása, ...

$$\exists s_0, s_1, \dots, s_k : I(s_0) \wedge \bigwedge_{i=0}^{k-1} R(s_i, s_{i+1}) \wedge TG$$

The diagram illustrates the decomposition of the SAT formula into three components. The formula is written as $\exists s_0, s_1, \dots, s_k : I(s_0) \wedge \bigwedge_{i=0}^{k-1} R(s_i, s_{i+1}) \wedge TG$. Below the formula, three labels are connected to the corresponding parts of the formula by lines forming a wide 'V' shape. The first label, 'Állapot-szekvencia', is connected to the existential quantifier and the initial state $I(s_0)$. The second label, 'Modell széthajtogatás', is connected to the transition relation $\bigwedge_{i=0}^{k-1} R(s_i, s_{i+1})$. The third label, 'Teszt cél', is connected to the test goal TG .

- Ha ez a formula **kielégíthető**, akkor az egy tesztet ad:
 - A teszt teljesíti a TG kritériumot
 - Ha nem kielégíthető a formula, akkor nincs teszt a kritériumhoz

Használhatóság

- A tesztgenerálás korlátai
 - Legfeljebb adott hosszúságú teszt generálható
 - Iteratívan növelhető a kibontás korlátja
 - Így részleges megoldás adódik
 - Amit megtalál, az biztosan teszt eset lesz
 - Nem garantált, hogy megtalálja a teszt esetet (ha az hosszabb lenne, mint amit figyelembe veszünk)
- A modellből SAT probléma leképezése automatikus
- A TG teszt célok megadása egyszerűsíthető
 - C programokhoz: FQL nyelv teszt célokhoz (FSHELL)
`in /code.c/ cover @line(6),@call(f1) passing @file(code.c) \ @call(f2)`
 - Elő- és utófeltételek megadása:
 - Előfeltétel szerepe: Érvényes teszt adatok
 - Utófeltétel szerepe: Van-e olyan teszt eset, amikor nem teljesül?
 - Ellenpélda generálás

Tartalomjegyzék

- Motiváció
 - Modellek szerepe a tesztelésben
 - Modell alapú tesztgenerálás
- Tesztgenerálás fedettségi kritériumokhoz
 - Direkt algoritmusok
 - Modellellenőrzők használata
 - Tesztgenerálás korlátos modellellenőrzéssel
- **Tesztgenerálás hibamodellek alapján**
 - **Modell mutációk**
 - **Ekvivalencia relációk tesztgeneráláshoz**
- Eszközök a tesztgeneráláshoz

Hibamodellek használata

- Tapasztalatok a szoftver tesztelés során
 - **Csatolási effektus** (coupling effect): Azok a teszt esetek, amik egyszerű hibákat megtalálnak, bonyolultabbakra is hatékonyak
 - **Kompetens programozó hipotézis**: A programok általában jók, a hibák nagy része gyakran előforduló tipikus hiba
- Alapötlet:
 - Állítsunk elő olyan „mutáns” modelleket, amik **tipikus hibákat** tartalmaznak, és generáljunk ezek kimutatására tesztek
 - Ezek várhatóan **bonyolultabb hibákhoz** is jobbak a véletlen tesztekénél
- Tipikus mutációk:
 - Aritmetikai operátorok felcserélése feltételekben
 - Akciók (műveletek, üzenetek) sorrendjének megváltoztatása
 - Akciók kihagyása
 - ...

Tesztgenerálás hibamodell alapján

- A tesztgenerálási feladat:
 - Olyan tesztek előállítása, amelyek **különbséget tesznek** az eredeti (hibamentes) és a mutáns (hibás) viselkedés között
 - Ezek ún. **negatív tesztek** (sikertelen lesz a teszt: nincs hiba!)
- Hogyan definiáljuk a „különbséget” két viselkedés között?
 - Specifikált – implementált, hibamentes – mutáns viselkedés között

Milyen különbség megengedett?

- **Más viselkedés** megengedett-e a specifikált mellett?
 - Pl. több kimenet, más reakció, ...
 - **Kihagyás** (elmaradt kimenet) megengedett-e?
- Szokásos megoldások
 - Biztonságkritikus rendszer a fejlesztés végén:
 - Szigorúan a specifikáció szerint
 - Teljes specifikáció szükséges
 - „Hétköznapi rendszer” fejlesztés közben:
 - Beférjen a tesztelt implementáció specifikáció keretei közé

k-ekvivalencia a teszteléshez

- Alkalmazás: Fekete doboz teszteléshez
 - Bemenetek egy s állapotban: $in(s)$ – vezérelhetők
 - Kimenetek egy s állapotban: $out(s)$ – megfigyelhetők
 - Kimeneti akció hiánya is formalizálható: Speciális δ akció
- A k-ekvivalencia definíciója:

Azonos bemeneti sorozat mellett azonos kimenetek az első k lépésre

- Jelölések:

Kezdeti állapot predikátum:

Állapotátmeneti reláció:

Eredeti M modell:

$I(s_0)$

$R(s_i, s_{i+1})$

Mutáns M' modell:

$I'(s'_0)$

$R'(s'_i, s'_{i+1})$

A modell kibontása k lépésre:

$$I(s_0) \wedge \bigwedge_{i=0}^{k-1} R(s_i, s_{i+1})$$

Mutáció alapú tesztgenerálás k-ekvivalencia alapján

- SAT formula konstruálás a k-ekvivalenciához:
 - Azonos bemeneti szekvencia mindkét modellre
 - Kibontás k lépésben az eredeti modellre
 - Kibontás k lépésben a mutáns modellre
 - Legalább egy különböző kimenet lesz a kimeneti szekvenciában

$$\bigwedge_{i=0}^k (\text{in}(s_i) = \text{in}(s'_i)) \wedge I(s_0) \wedge \bigwedge_{i=0}^{k-1} R(s_i, s_{i+1}) \wedge I'(s'_0) \wedge \bigwedge_{i=0}^{k-1} R'(s'_i, s'_{i+1}) \wedge \bigvee_{i=0}^k (\text{out}(s_i) \neq \text{out}(s'_i))$$

Egyező
bemenetek

Eredeti
modell

Mutáns
modell

Eltérő
kimenet

- Ha ez a formula kielégíthető, akkor az egy tesztet ad
 - A teszt különbséget tesz a modellek között:
Kimutatja a mutációt, tehát a hiba felderítésére használható
 - Ha a formula nem kielégíthető, akkor ekvivalens a két modell

Mutáció alapú tesztgenerálás az IOCO reláció alapján

- Az IOCO reláció informálisan:
 - Megengedett, hogy azonos bemeneti szekvenciára a **mutáns modell** kimenetei **részalmazát** képezik az eredeti modellben rögzített kimeneteknek (azaz „beleférnek” az eredeti modellbe)
 - Részleges viselkedés megengedett, de eltérő viselkedés nem
 - Többlet funkció megengedett az eredeti modellben nem rögzített bemeneti szekvenciára
 - A k-ekvivalenciánál megengedőbb konformancia reláció
- Definíció:

Minden, az eredeti modellben felvehető akciószekvenciára igaz:
Az így elérhető **állapotokban** a **mutáns** által nyújtott **kimeneti akciók** részalmazát képezik az **eredeti modell** által nyújtott **kimeneti akcióknak**
- Tesztek generálhatók SAT megoldóval
 - Bonyolultabb a részalmaz reláció vizsgálata miatt (itt nem írjuk fel)

Tartalomjegyzék

- Motiváció
 - Modellek szerepe a tesztelésben
 - Modell alapú tesztgenerálás
- Tesztgenerálás fedettségi kritériumokhoz
 - Direkt algoritmusok
 - Modellellenőrzők használata
 - Tesztgenerálás korlátos modellellenőrzéssel
- Tesztgenerálás hibamodellek alapján
 - Modell mutációk
 - Ekvivalencia relációk tesztgeneráláshoz
- **Eszközök a tesztgeneráláshoz**

Példák automatikus tesztgeneráló eszközökre I.

- **Tesztelés modellellenőrzővel**
 - **FSHELL: C programokhoz**
 - CBMC (korlátos modellellenőrző) generálja az ellenpéldát mint teszt szekvenciát strukturális tesztelési kritériumokhoz
 - **BLAST:**
 - Ellenpélda generálás adott teszt célhoz: Absztrakt teszt eset
 - Szimbolikus végrehajtás: Teszt adatok generálása
 - **UPPAAL CoVer, TRON:**
 - Valós idejű rendszerek modellezése: Időzített automaták
 - UPPAAL modellellenőrző generálja a teszt eseteket
 - Konformancia reláció a teszteléshez:
 - „Relativised timed input-output conformance (RTIOCO)”
 - Időkezelés nélkül konzisztens az IOCO relációval

Példák automatikus tesztgeneráló eszközökre II.

- Üvegdoboz tesztelés specifikáció alapján
 - JET: JUnit váz generálása JML elő- és utófeltételek alapján
 - Előfeltétel: Véletlen teszteléshez kötöttséget ad
 - Utófeltétel: Test oracle generálható
 - DART, CUTE, jCUTE, EXE
 - Adott állapothoz vezető bemeneti szekvencia: A feltételeket tartalmazó **kényszerkielégítési probléma** megoldása és szimbolikus végrehajtás
 - Feltételek a SAT bemenetéhez hasonlóan generálhatók
 - SpecExplorer (C#):
 - Spec# specifikáció alapján modell automata képzése (dinamikusan)
 - Bejárás: **Gráfelméleti**, legrövidebb út, vagy véletlen bejárás
 - Konformancia reláció modell és program között: Alternating simulation
 - DOTgEAR (Java):
 - Adatfolyam alapú kritériumok szerinti tesztelés is (all-defs, all-uses)
 - **Evolúciós algoritmussal**, véletlen bejárás alapján indítva és módosítva

Példák automatikus tesztgeneráló eszközökre III.

- Tesztelés absztrakt adattípusok alapján
 - Absztrakt adattípus definícióban szereplő axiómák alapján generált tesztesetek

- Axió

Absztrakt adattípusok: hordozó halmaz és műveletek

- Spec

- S

- A

- A

- T

- T

```
Type Boolean is
  sorts Bool
  opns
```

```
  false, true : -> Bool
  not : Bool -> Bool
  and : Bool, Bool -> Bool
```

```
  eqns
```

```
  forall x, y: Bool
  ofsort Bool
    not(true) = false;
    not(false) = true;
    x and true = x;
```

Példák automatikus tesztgeneráló eszközökre III.

- Tesztelés absztrakt adattípusok alapján
 - Absztrakt adattípus definícióban szereplő axiómák alapján generált tesztesetek
 - Axiómákban szereplő változóknak értékadás
 - Ekvivalencia osztályok, szélső értékek
- Speciális modellezési nyelvek támogatása
 - STG: LOTOS specifikációs nyelv
 - AGATHA: UML, SDL, STATEMATE modellek
 - Kényszerkielégítési probléma megoldása (változók kezelése):
útvonal bejárás feltételek generálása
 - Autolink: SDL és MSC specifikáció alapján
 - TDE/UML: Fedettségi kritériumok és kényszerek megadhatók
 - Conformiq: UML (állapottérkép) modellekhez
 - T-Vec, DesignVerifier, Reactis, AutoFocus: Simulink modellekhez

Összefoglalás

- Modell alapú tesztgenerálás
 - Fedési kritériumok teljesítéséhez
 - Vezérlés-orientált: állapotok, átmenetek fedése
 - Adatfolyam-orientált: értékadás és használat fedése
 - Specifikációval nem konform viselkedés kimutatásához
 - k-ekvivalencia reláció szerint
 - IOCO reláció szerint
- Algoritmusok és eszközök
 - Direkt (gráfelméleti) algoritmusok: Bejárás generálása
 - Modellellenőrzők: Bejárás mint ellenpélda generálása
 - SAT megoldók: Helyettesítési értékek generálása
 - Tervkészítő algoritmusok: Cél-orientált bejárás
 - Kényszer-kielégítők: Bejárasi feltételek teljesítése
 - Evolúciós algoritmusok: Intelligens keresés